

вым, и при относительно малой деформации можно достичь (при низких темп-рах) заполнения долин только одного типа за счёт полного опустошения остальных [2].

Перераспределение носителей между долинами можно получить в сильном электрич. поле, направленном под разл. углами к осям долин. При этом носители из разных долин «нагреваются» полем по-разному (см. *Горячие электроны*) и с разл. скоростью покидают «свои» долины, переходя в «чужие». Возникающее перезаселение долин приводит к большим нелинейным восприимчивостям М. п. в сравнительно слабых электрич. полях. С этим связаны такие эффекты, как анизотропия электроопроводности в «греющих» электрич. полях (см. *Сасаки — Шибуя эффект*), нечётное по *H* магнитосопротивление (в т. ч. линейное) и чётный по *H* *Холла* эффект. С междолинным перераспределением носителей связаны также специфические для М. п. механизмы *акустоэлектрического эффекта*, поглощения звука, электрич. шумов, а также размерные эффекты [3]. Условия междолинного перераспределения, ответственного за большую величину этих эффектов: а) редкие переходы носителей из одной долины в другую по сравнению с внутридолинными переходами; б) слабый энергобмен между носителями из разных долин (по сравнению с их энергообменом с фононами), достигаемый при малой концентрации носителей [4].

М. п. с эквивалентными долинами. К ним относятся три важнейших полупроводника с решёткой алмаза: алмаз, Ge, Si *n*-типа. В Ge наимизшие минимумы зоны проводимости находятся на краю зоны Бриллюэна в *L*-точках (в точках пересечения осей [111] с границей зоны Бриллюэна, рис. 2); в окрестностях этих точек образуется 4 долины (*L*-долины), причём в пределах зоны Бриллюэна каждая изоэнергетич. поверхность состоит из 8 полуэллипсоидов вращения. В долинах вдоль осей [111] m_1 в 19 раз превышает m_1 . В алмазе и Si наимизшие экстремумы зоны проводимости расположаются на осях типа [100] (*Δ*-осиах) сравнительно близко к границе зоны Бриллюэна, но не на ней, наимизшиими являются 6 долин, попарно расположенных на осях [100], [010] и [001]. Носители в соосной паре долин ничем не отличаются друг от друга, такая пара долин может рассматриваться как одна с удвоенной плотностью состояний, а рассечение носителей между долинами пары — как внутридолинное рассеяние.

К М. п. относятся также кристаллы с решёткой сфalerита: электронные BN, GaP, AlSb. Наимизшие мини-

водникам относятся GaSb, InP и др. При термодинамич. равновесии все электроны располагаются вблизи дна зоны проводимости (в изотропной Г-долине). При разогреве носителей электрич. полем происходит междолинное перезаселение с изоэнергетическим заполнением более высоких долин, где электроны «тянутся» и, следовательно, *плотность состояний* больше, чем в Г-долине. Следствием такого перезаселения является (в частности) *Ганна эффект*, в основе к-рого лежит *N*-образный вид статической вольтамперной характеристики (ВАХ) М. п. с неэквивалентными долинами. Падающая ветвь ВАХ обусловлена «потяжелением» электронов и уменьшением их подвижности из-за ухода в верхние долины.

Аналог эффекта Ганна наблюдается также и в М. п. с эквивалентными долинами, где ВАХ при токе в направлении, совпадающем с направлением большой эф. массы одной из долин ([100] в *n*-Si и [111] в *n*-Ge), также имеет падающий участок из-за ухода электронов в эту долину из др. долин, т. к. в них электроны сильнее разогреваются (эффект Рыбкина — Кастальского).

Лит.: 1) Цидильковский И. М., Зонная структура полупроводников, М., 1978; 2) Бир Г. Л., Пинкус Г. Е., Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, М., 1972; 3) Рашиб Э. И., Грибников З. С., Кравченко В. Я., Анизотропные размерные эффекты в полупроводниках и полуметаллах, «УФН», 1976, т. 19, с. 3; 4) Гантмахер В. Ф., Левинсон И. Б., Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках, М., 1984; см. также лит. при ст. *Полупроводники*.

З. С. Грибников.

МНОГОЗАРЯДНЫЕ ИОНЫ (высокоионизованные атомы) — положительно заряженные ионы с большой кратностью ионизации. М. и. участвуют в процессах, протекающих в высокотемпературной лабораторной и астрофиз. плазме.

Специф. особенности М. и., отличные от свойств нейтральных атомов с таким же числом электронов, объясняются их сильным кулоновским полем. К таким особенностям относятся конечная величина сечений возбуждения М. и. электронами при пороговых значениях энергии (ср. с *возбуждением атома и молекулы*), наличие резонансных циклов на кривой зависимости эф. сечений от энергии, восстановление правильного порядка заполнения электронных оболочек (у нейтральных многоэлектронных атомов он нарушается; см. *Атом*), наличие линий-сателлитов в спектрах испускания (см. ниже) и т. д.

Спектроскопич. символ иона z ($z = Z - N + 1$, где Z — заряд ядра иона, N — число электронов в нём) определяет масштаб величины радиац. и столкновит. характеристик. Так, расстояние между уровнями энергии и ионизационный потенциал $\sim z^2$, длина волн спектральных линий $\sim z^{-2}$, потенциал электростатич. взаимодействия электронов с ядром $\sim z$, потенциал спин-орбитального взаимодействия $\sim z^4$, радиус иона $r_0 \sim z^{-1}$, лэмбовский сдвиг $\sim z^4$, вероятность электрич. дипольного перехода $\sim z^4$.

Эф. сечения столкновит. процессов также зависят от z . Эти процессы можно характеризовать масштабным фактором z^α , причём для процессов возбуждения и ионизации электронами $\alpha = -4$, для фотоионизации $\alpha = -2$, перезарядки при столкновениях с нейтральными атомами $\alpha = 1$, ионизации нейтральных атомов $\alpha = 2$ и т. д. Т. о., эф. сечения элементарных процессов с участием М. и. сильно зависят от партнёра по столкновениям и параметра z .

С ростом z существенно возрастает влияние релятивистских и радиц. эффектов на характеристики М. и., а тип связи угловых и спиновых моментов электронов отличается от *LS*-связи (см. *Связь векторная*): происходит непрерывный переход от *LS*-связи к *jj*-связи. Если спин-орбитальное и эл.-статич. взаимодействия одного порядка величины, то имеет место промежуточный тип связи.

В результате появления релятивистских эффектов меняются *отбора правила*, разрешаются переходы, зап-

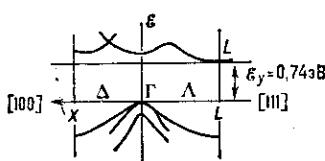


Рис. 2. Зонная структура кубического Ge для различных направлений симметрии.

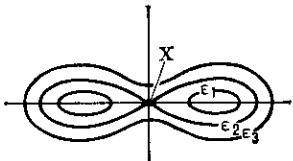


Рис. 3. Изознергетические поверхности $\epsilon_1 < \epsilon_2 < \epsilon_3$ в окрестности точки *X* зоны Бриллюэна.

муны зоны расположены на *Δ*-осиах [100], однако на границе (или почти на границе) зоны Бриллюэна (*X*-долины). При расположении минимумов почти на краю зоны (GaP) 2 эллипсоидальные изоэнергетич. поверхности при *не*значит. возрастании энергии носителей сливаются в одну неэллипсоидальную (рис. 3). Многодолинную структуру имеют также PbS, PbSe, PbTe, где электронные и дырочные долины расположены друг под другом в *L*-точках, и все полуметаллы.

Неэквивалентные долины. Термин «М. п.» применяют также к электронным полупроводникам с дном зоны проводимости ϵ_c при $k = 0$ (в центре зоны Бриллюэна Г) в случае, когда в сравнительно малом энергетич. удалении от ϵ_c есть более высокие минимумы $\epsilon(p)$ (М. п. с неэквивалентными долинами). К таким полупро-